

Nondeterministic Coverage Metrics as Key Performance Indicator for Model- and Value-based Testing

03. Februar 2011
David Faragó (farago@kit.edu)

Institute for Theoretical Computer Science; Logic and Formal Methods

TAV 31

Testing in modern
IT-Contexts

Übersicht

- Value-based Software Engineering
 - KPI & VBSE
 - Value-based Testing
 - _{opt} ROI des Testens
- Modell-basiertes Testen
 - MBT
 - _{opt} MBT-Methoden
- Überdeckungskriterien
- Nondeterminismus
 - Nondeterministische Systems
 - Arten des Nondeterminismus
 - Überdeckungskriterien für Nondeterminismus
 - Stand der Technik
 - n-choices
 - Quantisierung
- Zusammenfassung

Value-based Software Engineering

KPI

Key Performance Indicator:

- Kennzahl für Fortschritt oder Erfüllungsgrad
- z.B. ROI, Überdeckungskriterien, Sprint burndown

VBSE

Value-based Software Engineering:
Gesamte SW-Entwicklung wertbasiert (jeglicher Nutzen, nicht nur ökonomisch)

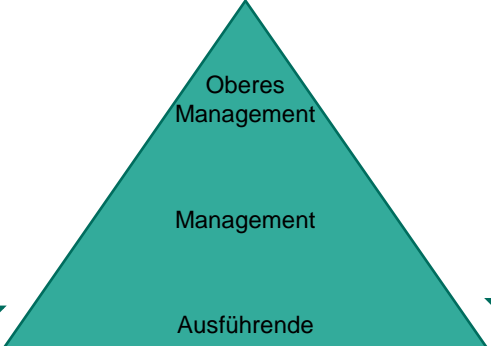
3 03.02.2011 David Faragó – Nondeterministische Überdeckungskriterien für MBT & VBT
www.kit.edu

Value-based Software Engineering

KPI

eindimensionale Information

Entscheidungen



Oberes Management

Management

Ausführende

VBSE

wertbasierte Entscheidungen werden delegiert

nur noch Berichterstattung

gefährlich: kann in falsche Richtung steuern, z.B. nur *defect detection percentage* und *loc per day*
 ⇒ *quick&dirty Programmierung und viele kleine Bugfixes*

Werte herunterbrechen und kommunizieren, z.B. mittels Priorisierung, Traceability und Risiko-Betrachtungen

4 03.02.2011 David Faragó – Nondeterministische Überdeckungskriterien für MBT & VBT
www.kit.edu

Value-based Testing



- Wert des Testens steigern
- Werte (über Testsuite, Bugtracker) Paretoverteilt \Rightarrow Priorisierung
- Anforderungs-basiertes Testen:
gewichte Anforderungen, um wichtiges früher und intensiver zu testen
- Risiko-basiertes Testen:
 - Risikobelastung (Schadenswahrscheinlichkeit x Schadensgröße) ist KPI für Qualitätsmängel und Fortschritt
 - priorisiere Testfälle & Bugfixes um Risikobelastung zu minimieren

5

03.02.2011

David Faragó – Nichtdeterministische Überdeckungskriterien für MBT & VBT

www.kit.edu

ROI des Testens



opt

maximiere ROI^[3,12]:

$$ROI = (\text{Gewinn} - \text{Kosten}) / \text{Kosten}$$

Kurzfristig:

- Bugerkennung erspart Nachbesserung
- erhöhte Planungssicherheit durch Risikoabschätzung

Langfristig:

- verbesserte Prozesse

Durch Konformität:
um Qualität zu erzielen

- Präventionskosten
- Bewertungskosten

Durch Nichtkonformität:
verursacht durch Qualitätsmangel

- interne Fehlerkosten
- externe Fehlerkosten

6

03.02.2011

David Faragó – Nichtdeterministische Überdeckungskriterien für MBT & VBT

www.kit.edu

Modellbasiertes Testen (MBT)



- Die beste Umsetzung von anforderungsbasiertem Testen ist es, aus den Anforderungen Blackbox-Tests zu generieren^[2].
- + MBT macht dies automatisiert
- + unterstützt VBSE auch durch Traceability und Priorisierung
- + frühe Verifikation
- + kann schnell auf Änderungen (Anforderungen, Risiken) eingehen
- + hohe Überdeckung
- + kann mit Nichtdeterminismus umgehen

7

03.02.2011

David Faragó – Nichtdeterministische Überdeckungskriterien für MBT & VBT

www.kit.edu

Opt. MBT-Methoden



Off-the-fly MBT: generiert $\xrightarrow{\text{Test-suite}}$ Ausführung & Evaluierung

z.B. TGV, Spec Explorer ineffizient, insbesondere bei Nichtdet. & Daten; keine dynamische Information

On-the-fly MBT: generiert $\xrightarrow{\text{Test-schritt}}$ Ausführung & Evaluierung

z.B. TorX-Derivate, UPPAAL Tron, Spec Explorer schwache Zielsuche für Testselektion

Lazy on-the-fly MBT: generiert $\xrightarrow{\text{Teil-Test-sequenz}}$ Ausführung & Evaluierung

Initiiere Ausführung, z.B. beim Erreichen von

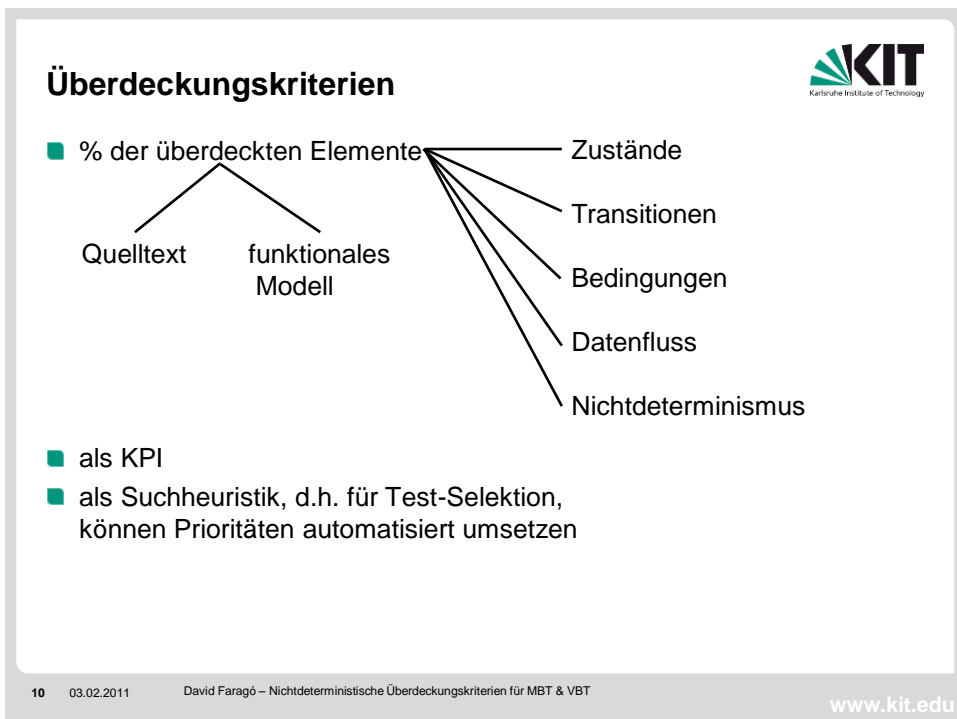
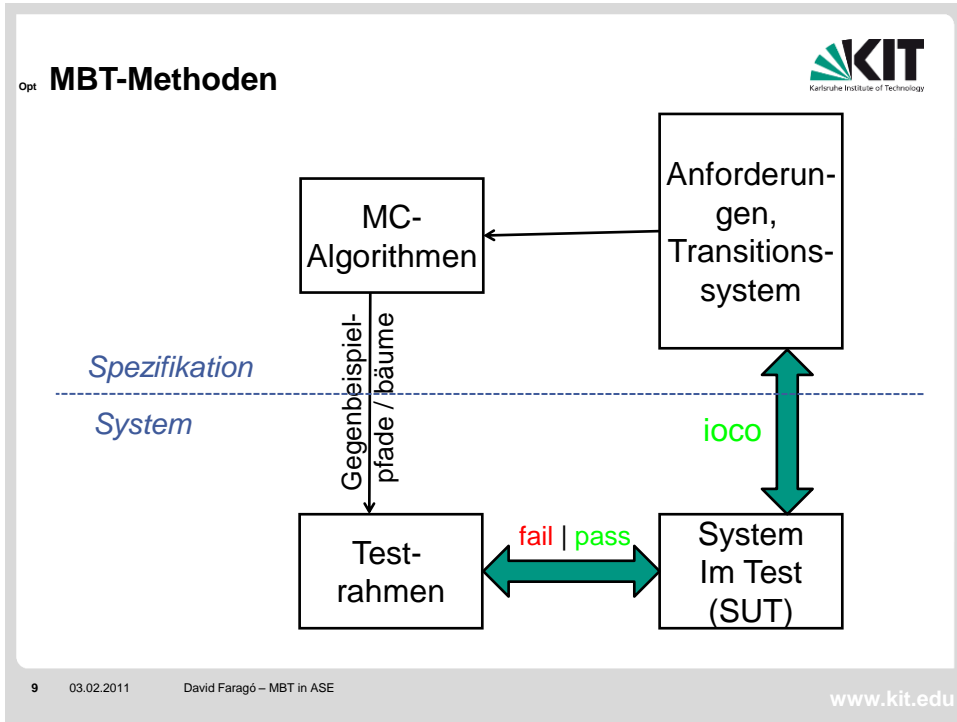
- Testzielpunkte
- einer bestimmten Tiefe
- Nichtdeterm. des SUTs
- + aussagekräftigere Testfälle
- + flexibler durch Reproduzierbarkeit und Wiederverwendbarkeit
- + Nichtdeterminismus des SUTs effizient behandelbar

8

03.02.2011

David Faragó – MBT in ASE

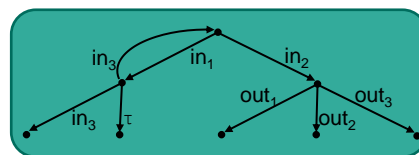
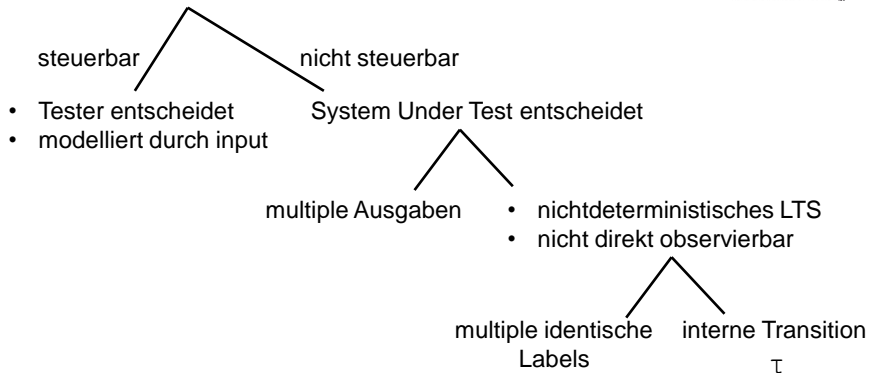
www.kit.edu



Nichtdeterministische Systeme

- Multiples Verhalten nach einem fixen Stimulus
- ⇒ Nichtdeterminismus auch modellieren
- bildet Realität am besten ab
- zur Unterspezifikation:
 - hilft, mit noch offenen Punkten umgehen zu können
 - erspart unnötige Umarbeiten
 - verringert die Initialkosten

Arten des Nichtdeterminismus



Überdeckungskriterien für Nichtdeterminismus

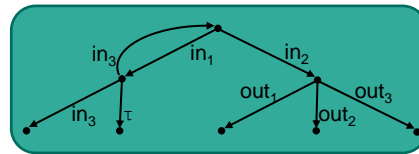
- multiples Verhalten überdecken
- ⇒ nichtdet. Testfälle müssen mehrfach ausgeführt werden
- 100% Überdeckung evtl. nie erreichbar

Stand der Technik

- Testfälle konstant k mal ausführen
 - + sehr einfach umsetzbar
 - + funktioniert für alle Arten von Nichtdeterminismus
 - manchmal zu häufig, manchmal zu selten
 - keine Informationen
- für Suchheuristiken für KPIs zu Nichtdeterminismus

n -choices

- Maß über Zuständen mit multiplen Ausgaben (*nichtdet.* Zustände)
- n – choices := $\frac{|\{s \in S \mid \text{von } s \text{ gab es } \geq n \text{ unterschiedliche Ausgaben}\}|}{|\{s \in S \mid s \text{ hat } \geq n \text{ unterschiedliche Ausgaben}\}|}$
- $n = 1$: wieviel nichtdeterministische Zustände wurden besucht
- $n = 2$: wieviel nichtdeterm. Zustände verhalten sich wirklich nichtdeterm.
- all-choices := $\frac{|\{\text{nichtdet. } s \in S \mid \text{alle Ausgaben von } s \text{ wurden gewählt}\}|}{|\{\text{nichtdet. } s \in S\}|}$
- wieviel Unterspezifikation vorhanden



n -choices

- 100% transition coverage \Leftrightarrow 100% all-choices \Leftrightarrow
 \Leftrightarrow 100% 2-choices \Leftrightarrow 100% 1-choices

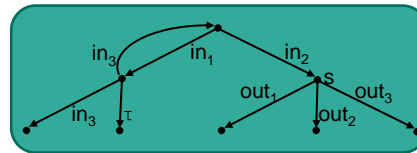
- + recht einfach umsetzbar
- + mehr Information

für Suchheuristiken

für KPIs zu Nichtdeterminismus
(wie häufig Ausnahmefälle / Unterspezifikation)

Quantifizierung (bei multiplen Ausgaben)

- Nondeterminismus \rightsquigarrow approximierter Probabilismus
- Zähle Anzahl Traversierungen
 $count(s)$ für Zustände, Transitionen
- \Rightarrow Approximiere Probabilismus,
z.B. $P_{visit}[out_1 \text{ from } s] = count(out_1)/count(s)$
- + Umsetzung noch praktikabel
- + viel Information $\left\{ \begin{array}{l} \text{für Suchheuristiken} \\ \text{für VBSE und KPIs zu Nondeterminismus} \\ \text{z.B. für anforderungs-basiertes und risiko-} \\ \text{basiertes Testen, } P[s \text{ from } s], \text{ Schadens-} \\ \text{wahrscheinlichkeit, Risikobelastung} \end{array} \right.$



Quantifizierung (bei nichtdeterministischen LTSs)

- Aktueller Zustand: Menge $S_{current} \subseteq S$
- \Rightarrow nur Menge der **potentiell** überdeckten Zustände (Transitionen, ...)
- wenig aussagekräftig, z.B. nicht monoton steigend
- irreführende Suchheuristik
- \Rightarrow quantifiziere jeglichen Nondeterminismus

Quantifizierung (bei nichtdeterministischen LTSS)



- Wahrscheinlichkeitsverteilung P_{current} über Zustände

$$\forall s \in S : P'_{\text{current}}[s] = \sum_{\bar{s} \in S} (P_{\text{current}}[\bar{s}] \cdot P_{\text{visit}}[s \text{ from } \bar{s}])$$

s.o., für nicht observierbaren Nichtdeterminismus: gleichverteilt

am Anfang: $P_{\text{current}}[s \in S_{\text{init}}] := 1/|S_{\text{init}}|$, $P_{\text{current}}[s \notin S_{\text{init}}] := 0$

- Wahrscheinlichkeiten P_{covered} über Zuständen (Transitionen, ...)

$$\forall s \in S : P'_{\text{covered}}[s] = P_{\text{covered}}[s] + (1 - P_{\text{covered}}[s]) \cdot P_{\text{current}}[s]$$

($\forall t \in T$, ... analog)

am Anfang: $P_{\text{covered}}[s \in S_{\text{init}}] := 1/|S_{\text{init}}|$, $P_{\text{covered}}[s \notin S_{\text{init}}] := 0$

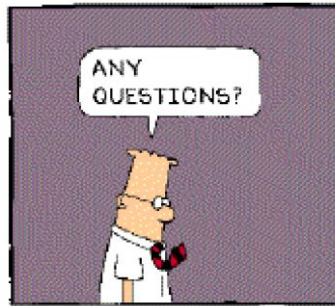
- + Information von oben auch für nichtdeterministische LTSS
- zu grobe Abschätzung?
- Berechnungen zu teuer?

Zusammenfassung



- KPIs: nicht isoliert, sondern innerhalb VBSE
- (nichtdeterministischen) Überdeckungskriterien gute KPIs innerhalb VBSE
- Quantifizierung nützlich bei multiplen Ausgaben

Vielen Dank!



Literaturverzeichnis

- [1] Boris Beizer. *Software testing techniques, (2nd ed.)*. Van Nostrand Reinhold Co., 1990.
- [2] Stefan Biffl, Aybke Aurum, Barry Boehm, Hakan Erdogmus and Paul Görnbacher, editors. *Value-Based Software Engineering*. Springer, Berlin, 2006.
- [3] Rex Black. *Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and Software Testing*. John Wiley & Sons, 2nd edition, 2002.
- [4] Barry Boehm. *Value-based software engineering: reinventing earned value monitoring and control*. SIGSOFT Software Engineering Notes, March 2003.
- [5] Manfred Broy, Bengt Jonsson, Joost-Pieter Katoen, Martin Leucker, and Alexander Pretschner. *Model-based Testing of Reactive Systems*. Springer, 2005.
- [6] J. Bullock. *Calculating the value of testing*. Software Testing and Quality Eng., 2000.
- [7] Margus Veanes et al. *Model-based testing of object-oriented reactive systems with Spec Explorer*. In Formal Methods and Testing, Springer, 2008.
- [8] D. Farago. *Coverage criteria for nondeterministic systems*. testing experience, The Magazine for Professional Testers, pages 104-106, 2010.
- [9] D. Farago. *Improved underspecification for model-based testing in agile development*. The 2nd International Workshop on Formal Methods and Agile Methods, 2010.
- [10] D. Farago. *Model-based testing in agile software development*. In TAV 30, STT, 2010.
- [11] Gordon Fraser and Franz Wotawa. *Test-case generation and coverage analysis for nondeterministic systems using model-checkers*. ICSEA, IEEE, 2007.

Literaturverzeichnis



- [12] F.M. Gryna. *Quality and Costs, Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill, 1999.
- [13] *KPI Library*. <http://kpilibrary.com/home/>. (November 2010).
- [14] Roman Pichler. *Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love*. Addison-Wesley, 2010.
- [15] Jeff Smith. *The K.P.I. Book*. Insight Training & Development, Limited, 2001.
- [16] Andreas Spillner and Tilo Linz. *Basiswissen Softwaretest: Aus- und Weiterbildung zum Certified Tester – Foundation Level nach ISTQB-Standard*. dpunkt, 3. edition, 2005.
- [17] Mark Utting and Bruno Legeard. *Practical Model-Based Testing: A Tools Approach*, Morgan Kaufmann, 1 edition, 2007.
- [18] Yuen-Tak Yu and Man Fai Lau. *A comparison of MC/DC, MUMCUT and several other coverage criteria for logical decisions*. Journal of Systems and Software, 2006.